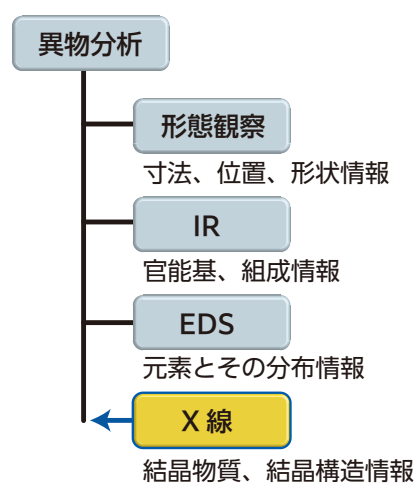


X線回折法による微小試料、微量成分の分析

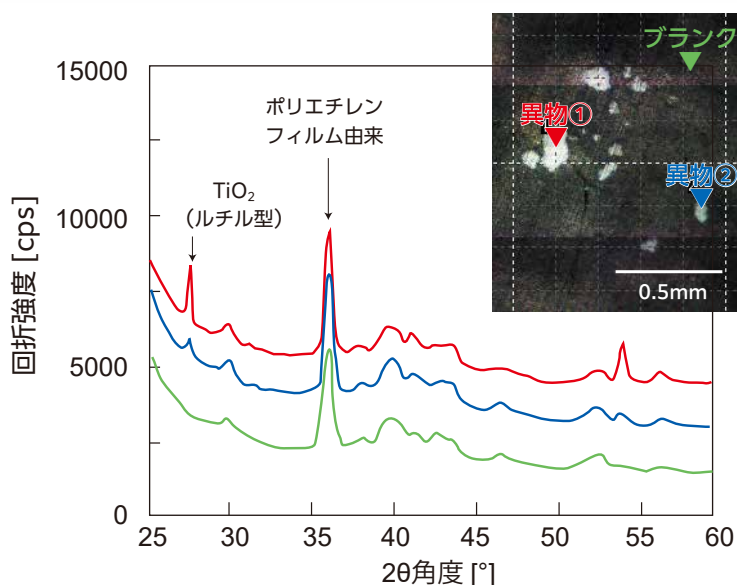
試料に X 線を照射して得られる回折パターンを解析することで、試料中に含まれる結晶物質とその結晶構造がわかる。

▶ 分析例 微小異物の分析

0.4mmφに集光した高輝度 X 線で測定できる弊社装置なら、一般的な装置では不可能な**微小試料・部位 (>100μm)**の結晶構造解析が可能



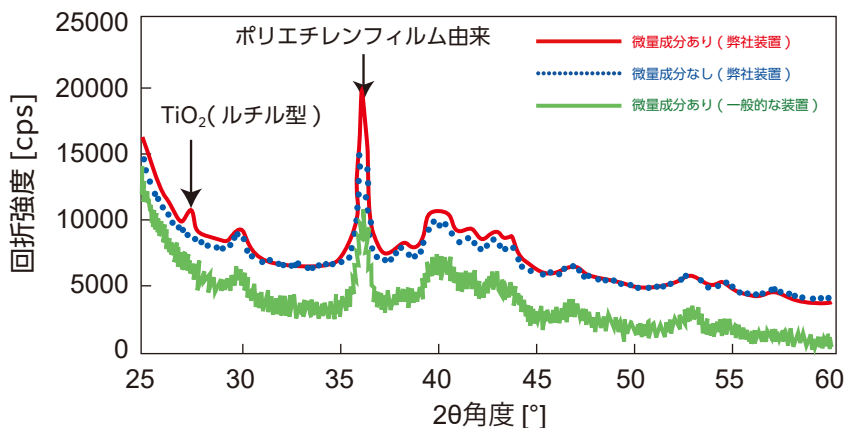
従来の異物分析では得られなかった情報



フィルム中に酸化チタン TiO_2 のルチル型*が異物として混入していることがわかった

▶ 分析例 微量成分の分析

高輝度 X 線、高感度検出器により高 S/N な測定ができる弊社装置なら、一般的な装置では不可能な**希薄な成分 (>0.1wt%)**の分析が可能



シート中に 0.1wt% 含有した酸化チタン TiO_2 (ルチル型*) が検出できている

※ 酸化チタン TiO_2 にはルチル型、アナターゼ型、ブルッカイト型の結晶多形がある

